

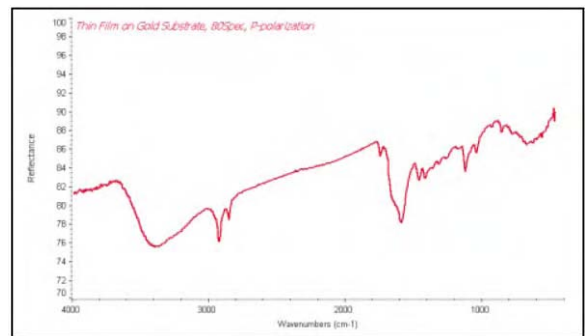
80Spec 高感度反射アクセサリ 薄膜測定用グレージング角度正反射測定装置



PIKE 社の 80Spec は、反射測定相対法により薄膜や単分子層の測定を行うことが出来る典型的な FTIR 用アクセサリです。

サンプルは単純にアクセサリの上部に測定面を下にしておくことで膜のスペクトルを測定できます。

一般にサンプル表面と直角をなす電場ベクトルに対し、非常に薄い膜サンプル(特に単分子層)の測定をする場合、P-偏光を使うことによりかなりピークが増強されます。



P-偏光を使用した、反射基板上的の非常に薄い薄膜のFFTIRスペクトル

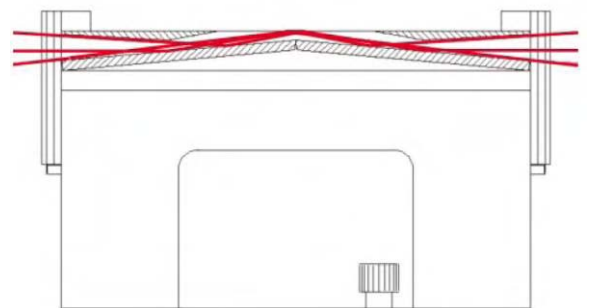
80Spec は、オプションの角度位置を手動や自動で決定できる赤外偏光子を、光の入射側、出射側の両方に取り付けることが出来ます。

基本的な測定方法は、固定されたサンプリングポートに対して平らなサンプリング表面を向けて置くだけで測定出来る特徴を持っています。この場合、測定面積はより大きく、均一な薄膜サンプルの分析に適しています。

また、サンプルの上の少ない面積をより明確に測定するため、3つのサンプルマスクが含まれています。このマスクにより、小さなサンプルに、または、場所によって異なる薄い膜層の測定に利用出来ます。

特徴

- ・ 金コートの反射を利用したグレージング角度反射アクセサリとして、最も高いスループットを有する光学系を持っています。
- ・ 偏光子を光の入射側、出射側の両方に取り付けることが出来ます。
- ・ オプションのサンプルマスクは、必要なサンプリング面積を明確にするために遮蔽します。
- ・ 安定した測定の為にアクセサリにはベースプレートを用意しています。ベースプレートは多くの FTIR に合わせてご供給することが出来ます。



80SPECの光路

ORDERING INFORMATION

| 品番 | 品名・内容 |
|----------|--|
| 012-10XX | 80Spec - 正反射測定アクセサリ 調整用金ミラー、デュアル偏光子マウントおよび FTIR 用ベースプレートが含まれています。 |
| 012-11XX | 80Spec - 正反射測定アクセサリ(サンプルマスク (3/8", 5/8" 2")付き 調整用金ミラー、デュアル偏光子マウントおよび FTIR 用ベースプレートが含まれています。 |
| オプション | |
| 010-3010 | 80Spec サンプルマスク (3/8", 5/8" 2") |
| 300-0002 | 調整用金ミラー (1.25" x 2.5") |
| 090-1000 | ZnSe 偏光子, ワイヤグリッド, 25 mm |
| 090-1200 | KRS-5 偏光子, ワイヤグリッド, 25 mm |

お問い合わせ、ご用命は

研究室のトータルコーディネーター
株式会社 テクノサイエンス

〒264-0034 千葉県若葉区原町929-8
TEL:043-206-0155 FAX:043-206-0188
<https://www.techno-lab.co.jp/>